หมวด 3 ส่วนที่ 3 การตรวจค้น

หัวข้อ **หน้า**

1.บทนำ 1

2. การตรวจค้นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว สำหรับใช้ในขั้นตอน
การตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive Examination) 2

3. สาระสำคัญการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตร 2

3.1 การตรวจค้นเนื้อหา 2

3.2 การตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรใดๆแล้วพบ
ความเกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น 6

4. การอ่านศึกษาเอกสารสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจค้น 6

5. การค้นหาการจำแนกประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IPC)
ของคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตร 7

6. การตรวจค้นสาขาวิทยาการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกัน 8

7. การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิและกำหนดองค์ประกอบในการตรวจค้น 9

7.1 การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิทั้งหมด 9

7.2 การกำหนดองค์ประกอบ (Elements) สำหรับการการตรวจค้น 10

8. การตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อการตรวจสอบสิทธิบัตร 11

8.1.แนวทางการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 11

8.2 การหยุดตรวจค้น (Termination of search) 14

9. การตรวจค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (Search under Special Circumstances) 15

9.1 การตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรให้ครอบคลุม
ในสาระสำคัญมากกว่าหนึ่งสาขาวิทยาการ 15

9.2 การตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่มีหลายการประดิษฐ์
ในคำขอเดียวกัน 16

10. สาระสำคัญการประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจค้น 17

หัวข้อ **หน้า**

11. เงื่อนไขในการตรวจค้นเพิ่มเติม (Supplementary Search) 17

12. รายงานผลการตรวจค้น (Search Report) 18

13. การสร้างรายงานผลการตรวจค้น (TH-DIP Search Report)
เพื่อประกอบการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์และการให้ความเห็น
จากการตรวจค้น (Written Opinion) 20

14. การตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรของคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กรณี 20

14.1 กรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรที่เคยยื่นนอกราชอาณาจักรก่อน
วันขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย 20

14.2 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยฯ 21

14.3 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสัญชาติไทยและยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
ไว้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรก 22

15. ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจค้น 22

16.บทสรุป 25

ภาคผนวก